



各 位

日新インダストリー株式会社

本社：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-15-11

イーストンビル西早稲田 2F

TEL：03-3209-2181 FAX：03-3232-6953

RoHS 指令物質不使用証明書

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社より納入しております下記対象商品は、RoHS 指令の特定有害物質が最大許容濃度を下回り、非含有であることを証明致します。

尚、2019年7月以降に追加される、4種のフタル酸エステルに関しては、試験方法が制定されていない（2016年11月現在）ため、試験は行っておりませんが、原料メーカーより意図的に使用していない旨の調査報告書の提供を受けております。

敬具

記

保証対象商品： ジンク Z96

保証対象物質： RoHS 指令特定有害物質（6種類）

特定有害物質	RoHS 指令最大許容濃度
1. カドミウム及びその化合物	0.01%
2. 六価クロム化合物	0.1%
3. 鉛及びその化合物	0.1%
4. 水銀及びその化合物	0.1%
5. ポリ臭化ビフェニル類（PBB 類）	0.1%
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE 類）	0.1%
7. フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）：DEHP	2019年7月以降追加
8. フタル酸ブチルベンジル：BBP	2019年7月以降追加
9. フタル酸ジブチル：DBP	2019年7月以降追加
10. フタル酸ジイソブチル：DIBP	2019年7月以降追加

各製品の含有量に関しては、別紙の試験データ（公共機関）をご参照下さい。

以上

成績証明書

平成 27年 11月 9日

会社名 日新インダストリー株式会社 様

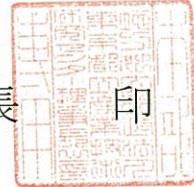
住所 169-0051
東京都新宿区西早稲田 2-15-11 イーストンビル西早稲田 2F

依頼品	ジंक Z96
依頼事項	エネルギー分散型蛍光X線分析によるCd, Pb, Hg, Cr, Brのスクリーニング分析 成績証明書の交付

平成 27年 10月 29日 付でご依頼のありました上記試験の成績は、次頁のとおりです。

平成 27年 11月 9日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長 印



- (注) ・成績証明書の記載内容は、利用者が持参した試験品に対する試験成績であって、商品(材料、部品、製品等)全体の性能・効能等を保証するものではありません。
・依頼品の品名、定格・仕様等は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・本成績証明書の内容を広告等その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

1. 依頼品

品名: ジンク Z96

依頼品名は依頼者の申し出により記載した。

2. 試験方法

依頼者の申し出により、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令(2011/65/EU; RoHS 指令) の規制物質のスクリーニング分析を行った。試験方法は IEC62321-3-1 Ed.1.0:2013(b)に準拠した。

試験装置

JIS K0119:2008「蛍光X線分析通則」に規定する装置を使用
エネルギー分散型蛍光エックス線分析装置
エレメントアナライザーJSX-3100R II (日本電子株式会社製)

試験条件

X 線管電圧 主成分,Cd 測定の際は 50kV、Pb,Hg,Br,Cr 測定の際は 30kV
X 線管電流 主成分,Cd,Pb,Hg,Br 測定の際は 1.000mA、Cr 測定の際は 0.085mA
測定時間 主成分,Cd,Pb,Hg,Br,Cr 測定の際は 60 秒
X 線照射径 主成分測定の際は ϕ 1.0mm、Cd,Pb,Hg,Br,Cr 測定の際は ϕ 7.0mm
使用フィルター 日本電子製 Cd 用フィルター(Cd 測定時)、Pb 用フィルター(Pb,Hg,Br 測定時)、Cr 用フィルター(Cr 測定時)、フィルターなし(主成分測定時)
測定雰囲気 大気
定量方法 検量線法(RoHS-metalcalib)
補正方法 形状補正、サムピーク補正、重なり補正
測定箇所 試験品をドラフトチャンバー内で3日間風乾させた。その後、図1に示すように、乾燥試験品約 2g を日本電子株式会社製の試料ホルダーに入れ、その中央付近 3ヶ所について測定し、規制物質の含有判定を行った。



図 1. ジンク Z96 の概観

3. 試験結果

表 1. Cd, Pb, Hg, Cr, Br の含有判定結果

依頼品名	測定元素(mg/kg)				
	Cd (カドミウム)	Pb (鉛)	Hg (水銀)	全 Cr (クロム)	Br (臭素)
ジンク Z96	100 未満	1000 未満	1000 未満	1000 未満	300 未満

注) 全 Cr : 価数の異なる Cr の含有量の合計量。全 Cr には規制の対象となっている六価 Cr のほかに三価 Cr など価数の異なる Cr も含有している可能性がある。

— 次葉に続く —

4. ジンク Z96 の蛍光エックス線スペクトル

ジンク Z96 の蛍光エックス線スペクトルを図 2～5 に示す。

なお、横軸は蛍光エックス線のエネルギー[keV]、縦軸は蛍光エックス線の計数率[cps]である。

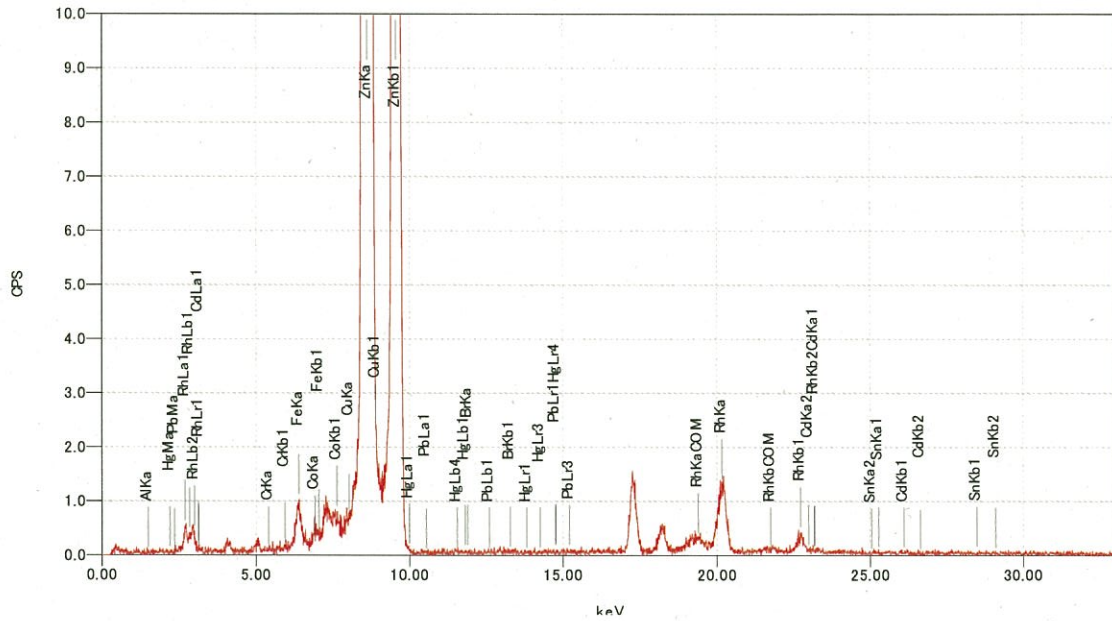


図 2. ジンク Z96 の蛍光エックス線スペクトル全体図

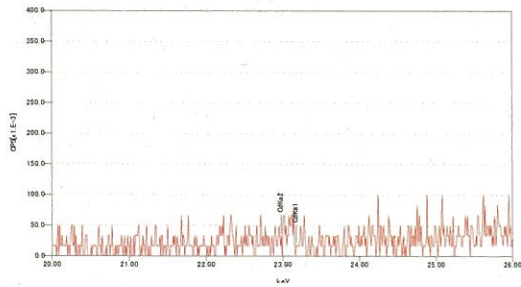


図 3. Cd ピークの拡大図

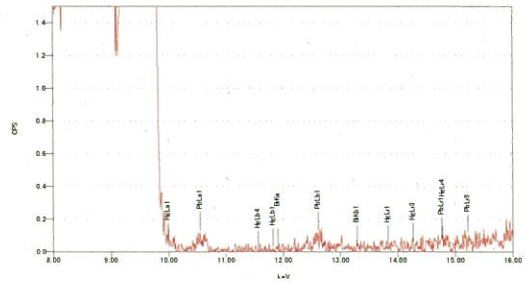


図 4. Pb, Hg, Br ピークの拡大図

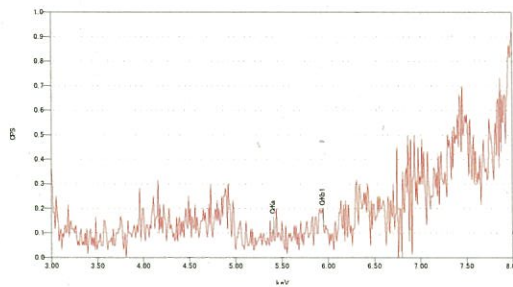


図 5. Cr ピークの拡大図

(参考) 有害元素分析における蛍光 X 線分析の位置付けについて

蛍光 X 線分析は個々の部材について有害元素の含有可能性を大まかに検討すること、ならびに、さらなる詳細分析の要否を判断することを目的として実施されるスクリーニング分析です。

— 以上 —